

FE-AES / μ -XPSによる分析Agメッキ表面の変色部評価

nmオーダーの極表面における表面分析アプリケーションのご紹介

	AES	XPS	TOF-SIMS
絶縁物	×	○	○
定量性	○	○	×
取得情報	×	△	○
	(元素情報)	(化学状態)	(構造・組成)



(FE-AES:JAMP7830)



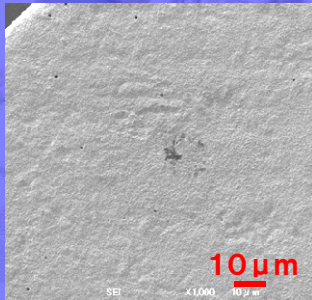
(μ -XPS:Quantera II)

例えば
こんなことができます!

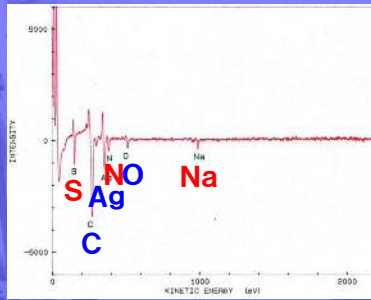
[AES] 表面定性分析&深さ方向分析(Agメッキ表面の変色部評価)



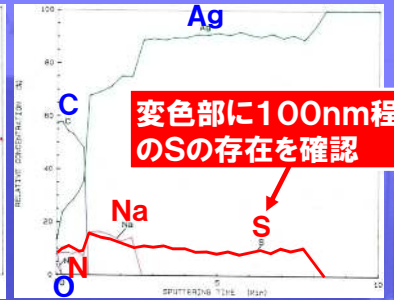
光学観察像



二次電子像



表面定性スペクトル

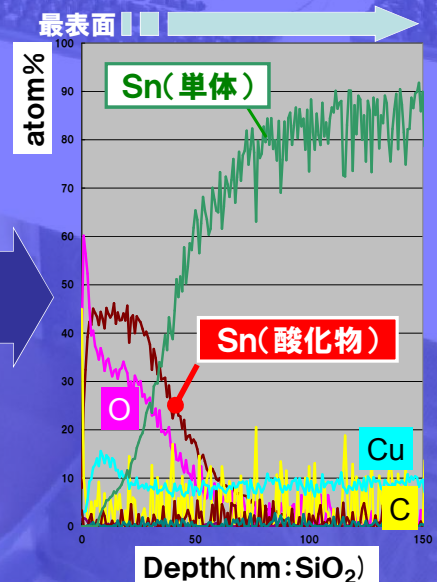
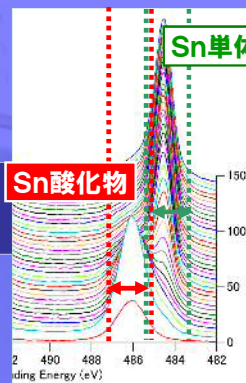
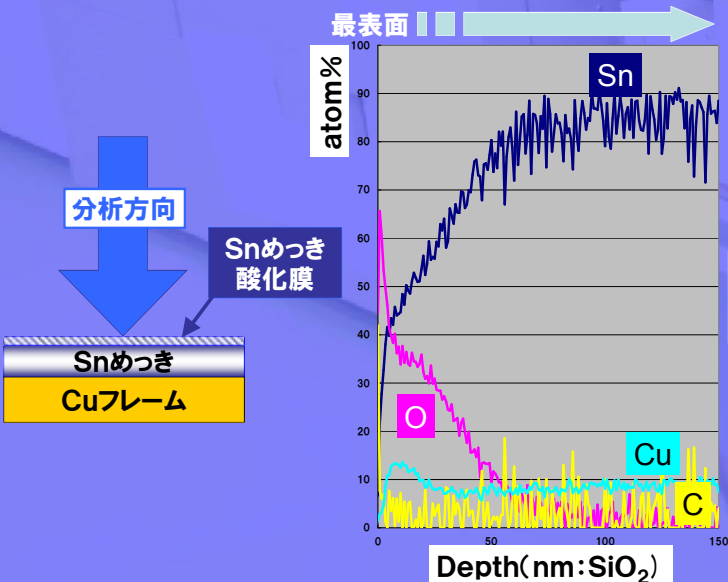


深さ方向分析

変色部に100nm程度のSの存在を確認

表面から数nm~数十nm程度の元素の存在を確認する事が可能

[XPS] 深さ方向分析 (Cuフレーム上のSnめっき表層構造評価)



化学状態をデプスプロファイルに反映することで、詳細に層構造を把握することが可能